

# 本技術に関する知的財産権



- 発明の名称 : 電気化学測定システム、電気化学探索方法、リアクタ、及びマイクロプレート
- 公開番号 : [WO-A1-2019/189252](#)
- 出願人 : 国立研究開発法人物質・材料研究機構
- 発明者 : 中西周次、松田翔一

- 発明の名称 : 自動電気化学測定システム、および、電気化学特性を自動測定する方法
- 公開番号 : [特開2020-153733](#)
- 出願人 : 国立研究開発法人物質・材料研究機構
- 発明者 : 松田翔一

- 発明の名称 : 電気化学測定システム、及び電気化学測定方法
- 公開番号 : [特開2020-183885](#)
- 出願人 : 国立研究開発法人物質・材料研究機構
- 発明者 : 松田翔一